한국센서연구소

KOREA SENSOR LAB

| Representative's Name | 이수민 Soo-min Lee E-mail goodsen@ksensor.co.kr Homepage http://ksensor.co.kr/ |
|--------------------------|--|
| Address | 34141 대전 유성구 대학로 291 KAIST 나노종합기술원 804호 34141, 291, Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Korea, #804, National NanoFab Center |
| Exhibits | 센서 및 반도체 소자 신뢰성 시험·분석, KOLAS 공인성적서, 일반성적서, pH센서, 가스센서 등 Sensor of Test & Analysis Service, KOLAS Testing Certificate, pH sensor, gas sensor etc |

전시품 개요

KOLAS 공인성적서

- KOLAS 성적서는 전세계 103개국에 통용됩니다.
- One Standard, One Test, Accepted Everywhere : 수출에 수반되는 중복시험이 배제되고 절차가 간소화됩니다.
- 반도체 소자 및 칩 분야에서 공인성적서 및 일반성적서 발행이 가능합니다.

센서 및 반도체 소자 신뢰성 시험·분석

- 국내유일의 반도체 소자 Wafer Level 신뢰성 평가 및 첨단 센서 1/f Noise 평가 기관입니다.
- 저주파노이즈는 센서 및 시스템 반도체의 성능을 결정합니다.

센서 감도 측정 장비

- 센서 및 소자의 저주파 노이즈 평가가 가능한 고성능 장비 입니다.
- 자동방식, 차폐성능, 정확한 진단 등의 특성을 가지고 있습니다.

적용분야

- 노이즈 시험·분석 : 반도체 소자, 다양한 첨단 센서, MEMS 소자/센서 등
- 신뢰성 시험·분석: 반도체 소자, 캐패시터, 저항, 인덕터, 다양한 첨단 센서, MEMS 소자/센서
- 센서 성능 시험·분석

Exhibits Description

KOLAS Test Report Service

- Accepted in 103 countries of the world
- One Standard, One Test, Accepted Everywhere: Trade procedure and cost saving of the enterprise
- JEDEC & MIL-STD about system semiconductor & sensors

Reliability Test, Analysis of Sensors and Semiconductor Devices

- Wafer level reliability test and advanced sensor 1 / f Noise
- Improve Sensitivity: KOREA SENSOR LAB provides the best service in nation

Sensor Sensitivity Measurement Equipment

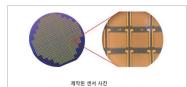
- High-performance equipment for low-frequency noise test of sensors and devices
- GOODSEN for measuring 1/f Noise, Reliability, RTS Noise, I-V, etc.

Field of Applications

- Noise test · Analysis : semiconductor device, Various advanced sensors, MEMS device / sensor, etc.
- Reliability Test / Analysis : Semiconductor devices, capacitors, resistors, inductors, Various advanced sensors, MEMS devices / sensors
- Sensor performance test and analysis







반도체 공정으로 센서 제작 Manufacturing of sensors by semiconductor process



복합센서장치 Combined sensor system



AI 반도체 Al Semiconductor